

計量規準型 1回샘플링檢査(KSA 3103)의 理論

黃 義 徹*

計量規準型 1回샘플링檢査는 ① 標準偏差를 알고 로트의 平均值를 保證할 때와 ② 標準偏差를 알고 로트의 不良率을 保證할 때의 두가지 경우가 있다.

로트의 品質을 로트의 平均值 또는 不良率로 나타낼 때에는 生産者 및 消費者가 요구하는 檢査特性을 갖도록 設計되어 있으며, 로트로부터 1회에 뽑은 샘플의 特性值의 平均值 \bar{x} 를 미리 알고 있는 標準偏差를 써서 계산한 合格判定值 X_U , 또는 X_L 과 비교하므로써 로트의 合格·不合格을 判定하는 檢査이다. 이와같이 로트의 合·否判定을 하는데 다음 3가지 경우가 있다.

- ① X_U 가 주어졌을 때 (特性值가 낮은 쪽이 바람직할 때)
- ② X_L 이 주어졌을 때 (特性值가 높은 쪽이 바람직할 때)
- ③ X_U 와 X_L 이 동시에 주어지는 경우 (特性值가 너무 높아도, 또는 너무 낮아도 안될 때)

이 檢査는 다른 型에 비해, 그 活用度가 높다. 그런데도 불구하고 檢査方式에 대한 理論의 說明이 不足하거나 너무 어렵게 되어 있어 일반에게 도움을 충분히 주지 못하고 있다.

本稿는 이 檢査方式에 대한 理論의 解説을 상세히 하여 사용하는 사람들의 理解를 돕고자 한다.

샘플링 檢査方式의 設計

(1) 로트의 平均值를 保證할 때

物品의 特性值가 낮은 것이 바람직할 때 즉, 上限合格判定值 X_U 를 구하고 싶을 때,

$$X_U = m_0 + G_0 \sigma \dots\dots\dots 1$$

物品의 特性值가 높은 것이 바람직할 때 즉, 下限

合格判定值 X_L 를 구하고 싶을 때

$$X_L = m_0 - G_0 \sigma \dots\dots\dots 2$$

또 上·下限合格判定值 X_U 및 X_L 을 동시에 구하고 싶을 때에는

$$\left. \begin{aligned} X_U &= m_0 + G_0 \sigma \\ X_L &= m_0 - G_0 \sigma \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 3$$

에 의해 계산한다.

(2) 로트의 不良率을 保證할 때

上限規格值 S_U 가 주어지는 경우 上限合格判定值 X_U 는

$$X_U = S_U - k\sigma \dots\dots\dots 4$$

下限規格值 S_L 이 주어지는 경우 下限合格判定值

$$X_L = S_L + k\sigma \dots\dots\dots 5$$

에 의해 X_L 을 계산하여 샘플의 平均值 \bar{x} 와 比較하면 된다. 즉 $\bar{x} \geq X_L$ 이면 로트는 合格으로 한다. 以上の 여러가지 샘플링方式에 대한 解説을 다음 項에서 하기로 한다.

샘플링 檢査方式의 理論 解説

一般의 計量샘플링檢査에서는 1로트를 구성하는 各單位體의 度数分布는 正規分布에 따른다는 前提를 두고 있다. 더욱 σ 를 알고 있다고 前提하기 때문에 로트의 平均值 m (또는 u 로 表示)와 下限規格值 S_L 이 주어지면 S_L 이하의 物品이 이 로트안에 들어 있을 確率 ϵ 는

$$K\epsilon = \frac{m - S_L}{\sigma} \dots\dots\dots 6$$

를 계산하여, 이 結果로부터 正規分布表에 의해 추정할 수 있다. 이를테면 $K\epsilon$ (또는 Pr), $K\epsilon$ 가 1.50이면 ϵ 는 6.68%, $K\epsilon$ 가 2.00이면 ϵ 는 2.28%가 된다. (그림 1 참조)

* 漢陽大學校 工大 産業工學科 教授

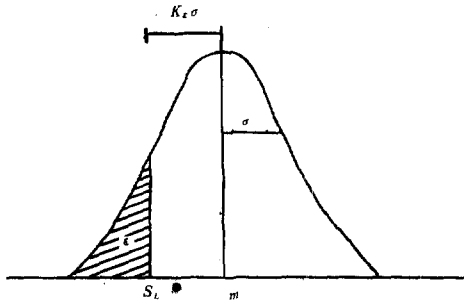


그림 1. 規格 S_L 과 ϵ

이 確率 ϵ 는 로트 전체에 대한 規格을 벗어난 것의 混入比率을 나타낸 것이기 때문에 이것을 不良率이라 부르고 ϵ 대신 p 로 나타내기로 하자. 로트의 平均值 m 와 上限規格值 S_L 가 주어진 경우에도

$$K_p = \frac{S_L - m}{\sigma} \dots\dots\dots 7$$

로부터 正規分布表에 의해 不良率을 위와 같이 추정할 수 있다.

a) 平均值를 保證하는 경우

① 特性值가 낮을수록 좋은 경우

平均值 m , 標準偏差 σ 인 로트로부터 크기 n 인 샘플을 뽑았을 경우에 샘플의 平均值 \bar{x} 의 分布는 平均值 m , 標準偏差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 의 正規分布를 하므로 그림 2로부터 다음과 같은 관계가 成立된다.

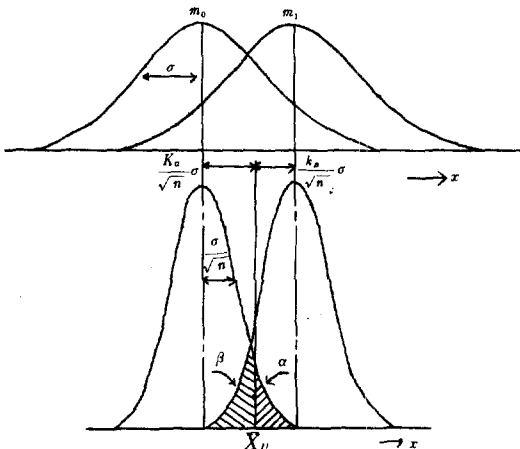


그림 2 說明圖(特性值가 낮을수록 좋은 경우)

$$X_L = m_0 + K_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 8$$

$$X_L = m_1 - K_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 9$$

式(8), (9)로부터

$$m_1 - m_0 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (K_\alpha + K_\beta)$$

샘플의 크기 n 은,

$$n = \left(\frac{K_\alpha + K_\beta}{m_1 - m_0} \right)^2 \sigma^2 \dots\dots\dots 10$$

式(8)에서

$$\frac{K_\alpha}{\sqrt{n}} = G_0 \dots\dots\dots 11$$

라고 하면 上限合格判定值 X_L 는

$$X_L = m_0 + G_0 \sigma \dots\dots\dots 12$$

로 된다.

② 特性值가 높을수록 좋은 경우

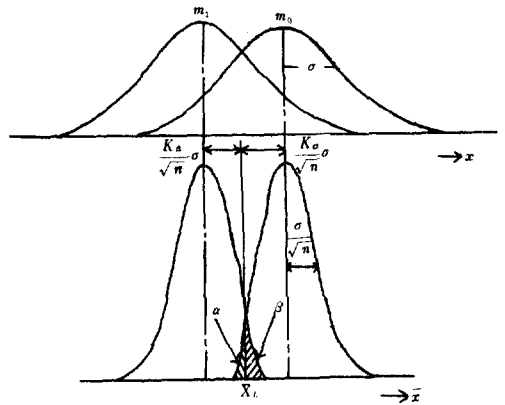


그림 3 說明圖(特性值가 높을수록 좋은 경우)

그림 3으로부터 ①과 같은 方法으로

$$X_L = m_0 - \frac{K_\alpha}{\sqrt{n}} \sigma \dots\dots\dots 13$$

$$X_L = m_1 + \frac{K_\beta}{\sqrt{n}} \sigma \dots\dots\dots 14$$

式(13)과 (14)로부터

$$m_0 - m_1 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (K_\alpha + K_\beta)$$

따라서 샘플의 크기 n 은,

$$n = \left(\frac{K_\alpha + K_\beta}{m_0 - m_1} \right)^2 \sigma^2 \dots\dots\dots 15$$

$\frac{K_\alpha}{\sqrt{n}}$ 대신 G_0 를 式(13)에 대입하면

$$X_L = m_0 - G_0 \sigma \dots\dots\dots 16$$

$\alpha = 0.05$, $\beta = 0.10$ 으로 놓았을 때의 n 과 G_0 는다.

음과 같이 된다.

式(10)과 (15)로부터 샘플의 크기 n 은 平均値가 낮을수록 좋은 경우나 높을수록 좋은 경우에도 같음을 알 수 있다.

$$\alpha=0.05, \beta=0.10 \text{ 일 때}$$

$$K_\alpha=1.64485, \quad K_\beta=1.28155$$

이 되므로

$$n = \left(\frac{2.9264}{m_1 - m_0} \right)^2 \cdot \sigma^2 \dots\dots\dots 17$$

이 된다.

上限 또는 下限合格判定値를 구하는 係數 G_0 는

$$G_0 = \frac{K_\alpha}{\sqrt{n}} = \frac{1.64485}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 18$$

b) 不良率을 保証하는 경우

① 上限規格值 S_u 가 주어진 경우 平均値 m , 標準偏差 σ 인 正規分布를 하고 있는 로트로부터 크기 n 인 샘플을 뽑을 경우의 샘플의 平均値 \bar{x} 의 分布는 平均値 m , 標準偏差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 인 正規分布를 하게 되므로 그림 4로부터

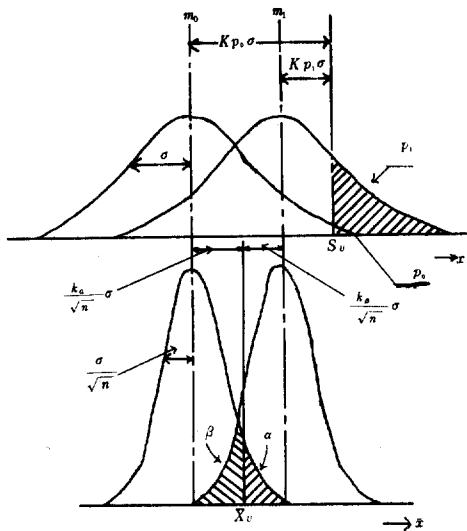


그림 4 說明圖 (S_u 가 주어진 경우)

다음의 關係를 얻게 된다(式 7 참조).

$$m_0 = S_u - K_{p_0} \sigma \dots\dots\dots 19$$

$$m_1 = S_u - K_{p_1} \sigma \dots\dots\dots 20$$

式 (19)과 (20)로부터

$$m_1 - m_0 = (K_{p_0} - K_{p_1}) \sigma \dots\dots\dots 21$$

式(8)과(9)로부터

$$m_1 - m_0 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} (K_\alpha + K_\beta)$$

이므로 이 式과 式(21)로부터

$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} (K_\alpha + K_\beta) = (K_{p_0} - K_{p_1}) \sigma$$

$$\sqrt{n} = \frac{K_{p_0} - K_{p_1}}{K_\alpha + K_\beta}$$

$$\therefore n = \left(\frac{K_{p_0} - K_{p_1}}{K_\alpha + K_\beta} \right)^2 \dots\dots\dots 22$$

合格判定値 X_v 는 式(8)과 (19)로부터

$$X_v = S_u - K_{p_0} \sigma + K_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 23$$

式 (22)와 (23)로부터

$$X_v = S_u - K_{p_0} \sigma + K_\alpha \sigma \frac{K_{p_0} - K_{p_1}}{K_\alpha + K_\beta}$$

$$= S_u - \frac{K_\alpha K_{p_1} + K_\beta K_{p_0}}{K_\alpha + K_\beta} \sigma$$

여기서

$$\frac{K_\alpha K_{p_1} + K_\beta K_{p_0}}{K_\alpha + K_\beta} = k \dots\dots\dots 24$$

이라고 하면

$$X_v = S_u - k \sigma \dots\dots\dots 25$$

가 된다.

② 下限規格值 S_L 이 주어진 경우

그림 5로부터 上記 ①과 같은 方法으로

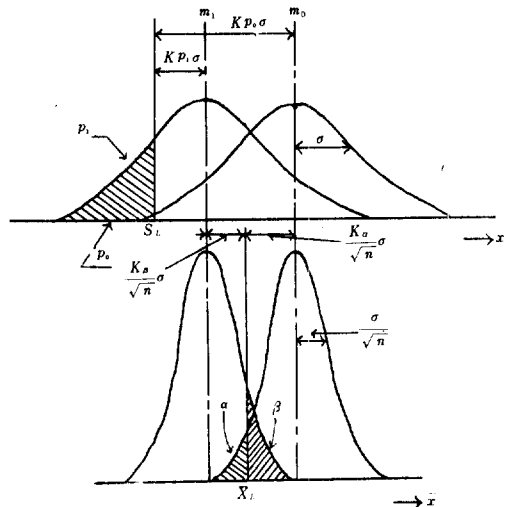


그림 5 說明圖 (S_L 이 주어진 경우)

$$m_0 = S_L + K_{p_0} \sigma \dots\dots\dots 26$$

$$m_1 = S_L + K_{p_1} \sigma \dots\dots\dots 27$$

式 (26)와 (27)으로부터

$$m_0 - m_1 = (Kp_0 - Kp_1) \sigma \dots\dots\dots 28$$

①과 같은 方法에 의해

$$n = \left(\frac{K_\alpha + K_\beta}{Kp_0 - Kp_1} \right)^2$$

이 되고 式 (22)과 같은 것이 된다. 下限合格判定値 X_L 은 그림 5와 式 (13) 및 (26)로부터

$$X_L = S_L + Kp_0 \sigma - K_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 29$$

式 (22)과 (29)로부터

$$\begin{aligned} X_L &= S_L + Kp_0 \sigma - K_\alpha \sigma \frac{Kp_0 - Kp_1}{K_\alpha + K_\beta} \\ &= S_L + \frac{K_\alpha Kp_1 + K_\beta Kp_0}{K_\alpha + K_\beta} \sigma \end{aligned}$$

式 (24)에 의해

$$X_L = S_L + k \sigma \dots\dots\dots 30$$

가 된다.

$\alpha = 0.05$, $\beta = 0.10$ 으로 놓았을 때의 n 과 G_0 는 다음과 같이 된다. $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.10$ 에 대해 $K_\alpha = 1.64485$, $K_\beta = 1.28155$ 이므로 n 은 式 (22)로부터

$$n = \left(\frac{2.9264}{Kp_0 - Kp_1} \right)^2 \dots\dots\dots 31$$

上限 또는 下限合格判定値를 구하는 계수는 式 (24)로부터

$$k = \frac{K_\alpha Kp_1 + K_\beta Kp_0}{K_\alpha + K_\beta} = \frac{1.64485Kp_1 + 1.28155Kp_0}{2.9264}$$

$$k = 0.562073Kp_1 + 0.437927Kp_0 \dots\dots\dots 32$$

이 된다.

[注 1] $\alpha \neq 0.05$, $\beta \neq 0.10$ 인 경우에는 그때의 α , β 에 대응하는 K_α 및 K_β 의 값을 쓰면 된다.

c) 양쪽規格이 주어졌을 경우

그림 6에 의해 양쪽規格이 주어졌을 경우의 檢査方式의 問題를 생각해 보자. 그림에서,

m_0' 는 平均値가 높은 쪽의 좋은 로트

m_0'' 는 平均値가 낮은 쪽의 좋은 로트

m_1' 는 平均値가 높은 쪽의 나쁜 로트

m_1'' 는 平均値가 낮은 쪽의 나쁜 로트

로 나타난다.

양쪽規格이 주어졌을 때의 合格判定値와 檢査方式의 設計는 上限과 下限規格에 獨立한 檢査方式이 適用된다는 條件下에서 이루어진 것이다.

즉, 上下의 合格判定値 X_U 와 X_L 이 멀리 떨어져 있어서 X_U 로 合否를 論하는 로트에 대해서는 X_L 은 생각하지 않아도 되고 또 X_L 로 合否를 論하는 로트에 대해서는 X_U 는 생각하지 않아도 되는 상태이면 上下에 獨立한 檢査方式이 適用될 수 있다.

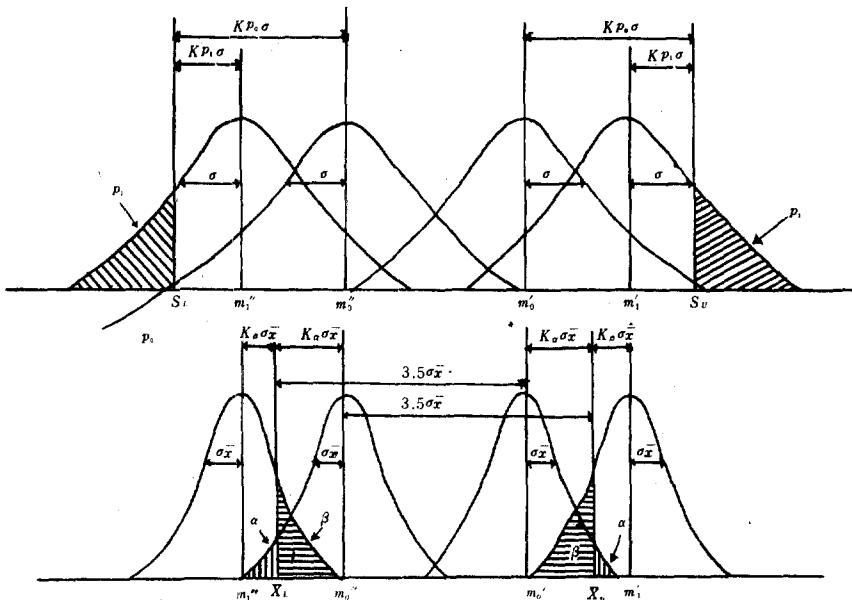


그림 6 양쪽規格 S_U 및 S_L 이 주어졌을 경우의 說明圖

따라서 가장 接近한 로트, 즉 母平均 m'_0 와 m''_0 의 두 로트의 相對關係가 重視된다. m'_0 를 두고 생각하면 X_U 에 의해 不合格이 되는 比率는 $\alpha = 5\%$ (KS에 의해)로 指定하지만 X_L 에 의한 不合格은 하나도 없이 할려는 것이다. 또 m''_0 에 대해서 보려는 X_L 에 의해 不合格이 되는 比率는 역시 $\alpha = 5\%$ 이지만, X_U 에 의한 不合格은 하나도 없이 할려는 것이다. 「不合格은 하나도 없다」고 하지만 完全히 제로란 理論的으로나 實際的으로 있을 수 없는 것이다.

거기서 圖示한 바와 같이 m'_0 와 X_L 의 거리를 $3.5\sigma\bar{x}$, m''_0 와 X_U 와의 거리도 $3.5\sigma\bar{x}$ 이상 떨어져 있으면 된다고 생각하는 것이다. 3.5를 취한 이유는 이것에 대한 한쪽 確率이 0.000232로서 거의 제로로 볼 수 있기 때문이다.

이것이 本項의 「키 포인트」이다.

그림 6의 윗 部分으로부터

$$\begin{aligned} m'_1 &= S_U - K_p \sigma \dots\dots\dots 33 \\ m'_0 &= S_U - K_p \sigma \dots\dots\dots 34 \\ m''_0 &= S_L + K_p \sigma \dots\dots\dots 35 \\ m''_1 &= S_L + K_p \sigma \dots\dots\dots 36 \end{aligned}$$

또 그림 6의 아랫 部分으로부터

$$\begin{cases} X_U = m'_1 - K_\alpha \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 37 \\ X_U = m'_0 + K_\alpha \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 38 \\ X_U = m''_0 + 3.5 \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 39 \\ X_L = m''_1 + K_\alpha \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 40 \\ X_L = m''_0 - K_\alpha \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 41 \\ X_L = m'_0 - 3.5 \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 42 \end{cases}$$

가 얻어진다. 따라서

$$\left. \begin{aligned} X_U &= m'_0 + K_\alpha \sigma \bar{x} \\ X_L &= m'_0 - 3.5 \sigma \bar{x} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 43$$

또는

$$\left. \begin{aligned} X_U &= m''_0 + 3.5 \sigma \bar{x} \\ X_L &= m''_0 - K_\alpha \sigma \bar{x} \end{aligned} \right\} \dots\dots\dots 44$$

가 얻어지게 된다. 여기서 $\alpha = 0.05$ 로 하면 (KS의 方針)

$$K_\alpha = 1.645 \div 1.6$$

이므로, 式 (43)로부터

$$\bar{X}_U - \bar{X}_L = (K_\alpha + 3.5) \sigma \bar{x} \div 5.1 \sigma \bar{x}$$

가 된다. 이것은 또 式 (4)에 의해서도 역시

$$X_U - X_L = (3.5 + K_\alpha) \sigma \bar{x} \div 5.1 \sigma \bar{x}$$

로 되어 같은 결과가 얻어진다. 어느식이던

$$\frac{X_U - X_L}{\sigma \bar{x}} = \frac{X_U - X_L}{\sigma / \sqrt{n}} > 5 \dots\dots\dots 45$$

가 얻어진다. 이것이 平均値의 높은 쪽과 낮은 쪽에 각각 獨立으로, $\alpha = 0.05$ 의 한쪽方式을 適用해도 된다는 必要條件의 式이다. 그러나, 이 式을 滿足시키고 있는가 어떤가는 위 아래 다 같이 n, X_U, X_L 이 결정된 후에야 「체크」가 가능하게 되기때문에. 不便이 따르게 된다. 그래서 「체크」를 좀더 이른 段階에서 할 수 있는 方法이 필요하게 된 것이다.

(1) 로트의 平均値를 保證할 경우

우선 로트의 平均値를 保證할 경우부터 생각해 보자

$$X_U = m'_0 + K_\alpha \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 46$$

$$X_L = m''_0 - K_\alpha \sigma \bar{x} \dots\dots\dots 47$$

로부터

$$X_U - X_L = (m'_0 - m''_0) + 2K_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 48$$

$$\therefore \frac{X_U - X_L}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{m'_0 - m''_0}{\sigma / \sqrt{n}} + 2K_\alpha \dots\dots\dots 49$$

$$\therefore \frac{m'_0 - m''_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{X_U - X_L}{\sigma / \sqrt{n}} - 2K_\alpha \dots\dots\dots 50$$

로 된다. 이 式의 右邊에서 제 1項은 $\alpha = 0.05$ 일 때, 式 (45)에 의해 5보다 커야 하고, 제 2項은 $\alpha = 0.05$ 일 때, $-2 \times 1.645 \approx -3.3$ 이다. 따라서

$$\frac{m'_0 - m''_0}{\sigma / \sqrt{n}} > 1.7 \dots\dots\dots 51$$

이것이 (이 경우의) 判別式이 된다.

이번에는,

順序 1 : 위 아래 어느쪽이던 한쪽만 우선 샘플의 크기 n 을 設計한다. 여기서는 윗 쪽을 택하기로 한다.

$$n = \left(\frac{K_\alpha + K_\beta}{m'_0 - m'_1} \right)^2 \cdot \sigma^2 \dots\dots\dots 52$$

順序 2 : 이 n 을 判別式(51)의 左邊에 代入하여

$$\frac{m'_0 - m''_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

의 값을 算出한다. 이 값이 1.7보다 크면는 안심하고 이 n 을 採用하고

順序 3 : 다시

$$\text{上限合格判定値 } X_U = \frac{m'_1 K_\alpha + m'_0 K_\beta}{K_\alpha + K_\beta} \dots\dots\dots 53$$

$$\text{下限合格判定値 } X_L = \frac{m''_1 K_\alpha + m''_0 K_\beta}{K_\alpha + K_\beta} \dots\dots\dots 54$$

를 算出하는 것이다.

順序 4 : 以上の 로트로부터 n 개의 random sample을 취해 그 平均値 \bar{x} 가

$$X_U \geq \bar{x} \geq X_L$$

이면 로트를 합격으로 하고, 그렇지 않으면不合格으로 한다.

[注 2] 式(53)은 式(12) 즉, $X_U = m_0 + G_0\sigma$ 와 같으며, 式(54)은 式(16) 즉, $X_U = m_0 - G_0\sigma$ 와 같다. 다만 각각의 導出方法이 다를 뿐이다.

式(53) 및 (54)의 導出方法:

그림 2의 아래部分으로부터

$$X_U = m_1 - K_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$X_U = m_0 + K_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

가 成立된다. 따라서

$$m_0 + K_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = m_1 - K_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\therefore m_1 - m_0 = (K_\alpha + K_\beta) \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$\therefore \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{m_1 - m_0}{K_\alpha + K_\beta}$$

$$\sqrt{n} = \frac{K_\alpha + K_\beta}{m_1 - m_0} \cdot \sigma$$

제곱하여

$$n = \left(\frac{K_\alpha + K_\beta}{m_0 - m_1} \right)^2 \cdot \sigma^2$$

를 얻게 된다.

또, X_U 는

$$X_U = m_1 - K_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$= m_1 - K_\beta \frac{m_1 - m_0}{K_\alpha + K_\beta}$$

$$= \frac{m_1(K_\alpha + K_\beta) - K_\beta(m_1 - m_0)}{K_\alpha + K_\beta}$$

가 되므로

$$X_U = \frac{m_1 K_\alpha + m_0 K_\beta}{K_\alpha + K_\beta}$$

가 되는 것이다.

그리고 平均値의 경우의 合格判定値는 X_U 와 X_L 의 公式이 一致한다. 따라서 양쪽規格이 주어졌을 경우에는 그림 6에 의해

$$X_U = \frac{m'_1 K_\alpha + m'_0 K_\beta}{K_\alpha + K_\beta}$$

$$X_L = \frac{m''_1 K_\alpha + m''_0 K_\beta}{K_\alpha + K_\beta}$$

로 表示된다.

(2) 로트의 不良率을 保證할 경우

그림 6의 윗 部分으로부터

$$U - L = (m'_0 - m''_0) + 2K p_0 \sigma \dots\dots\dots 55$$

를 얻게 된다. 이것은 또 式(34)와 (35)으로부터도 같은 결과를 얻을 수 있다.

그런데 式(51)로부터

$$m'_0 - m''_0 > 1.7 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 51$$

이므로

$$U - L > 1.7 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} + 2K p_0 \sigma$$

$$\therefore \frac{U - L}{\sigma} > \frac{1.7}{\sqrt{n}} + 2K p_0 \dots\dots\dots 56$$

가 된다. 安全側을 취하면, $n = 1$ 이라도

$$\frac{U - L}{\sigma} > 1.7 + 2K p_0 \dots\dots\dots 57$$

가 만족될 경우에는, 한쪽規格이 주어진 경우의 $\alpha = 0.05$ 의 샘플링方式을 上下양쪽의 規格에 대해 따로 따로 적용하면 된다.

参考文献

- 계량규준형 1회 샘플링검사 KS A 3103
- “샘플링검사” 韓國工業標準協會, 1973
- 上甲子郎: “計量抜取検査の實施化理論”, 日本科学技術連盟
- 朝香鉄一 監修: “抜取検査演習”, 日科技連, 1971